



کاربردی از مدل‌های حافظه بلندمدت و شکست ساختاری با استفاده از رویکرد کمی

منصور کاشی^۱

میرفیض فلاح شمس^۲

محمد دنیائی^۳

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۹۲/۳/۳۰

چکیده

فرایند حافظه کوتاه مدت با در برداشتن شکست ساختاری در میانگین، ممکن است به علت کاهش هیبروبولیک تابع خودهمبستگی یا دیگر خصوصیات، فرایند انباشته کسری را به تصویر کشد. در پژوهش حاضر به بررسی وجود احتمالی این امر با آزمون های نیمه پارامتریک و پارامتریک حافظه بلندمدت و تشخیص و تعیین نقاط زمانی شکست توسط آزمون های OLS مبنی بر SupF، CUSUM و بای و پرون (۲۰۰۳، ۱۹۹۸) پرداخته شده است. نتایج مشاهده شده حاکی از وجود همزمان حافظه بلندمدت و نقاط زمانی شکست در سری بازده TEPIX می باشد. بنابراین، برای استنباط صحیح در مورد حافظه بازار، ویژگی های آماری و آزمون های حافظه بلندمدت، در دوره های قبل و بعد نقاط زمانی شکست بررسی گردید. نتایج بدست آمده، از الگوی آماری تقریبی یکسان و وجود حافظه بلندمدت در تمام دوره های زمانی تقسیم‌بندی شده بواسطه شکست های ساختاری، آزمون GPH اصلاح شده اسمیت (۲۰۰۵) استفاده شد که در نتیجه، تخمین زن GPH تغییل شده از عدم تاثیری حافظه بلندمدت از نقاط شکست حمایت نمود. در نهایت می‌توان چنین ادعا کرد که حافظه بازده TEPIX، بلندمدت و حقیقی است و بالطبع، نمی‌تواند تحت تاثیر شکست های ساختاری باشد.

واژه‌های کلیدی: شکست ساختاری، حافظه بلندمدت، فرایند انباشته کسری، سطح انتقال.

۱- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

۲- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۳- دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، (مسئول مکاتبات) Mohammad_Donyaee@yahoo.com

۱- مقدمه

امروزه آنچه در بسیاری از مطالعات و مقالات مربوط به حافظه و تغییرات ساختاری مشهود و شناخته شده است، این مورد است که خصوصیات حافظه بلندمدت و شکست های ساختاری به آسانی باعث سردرگمی محققین در بررسی سری های زمانی مالی خواهد شد (Granger and Hyung, 2004; Diebold and Inoue, 2001 and Smith, 2005). بطوريکه تشخیص بین حافظه بلندمدت و شکست ساختاری به علت شبیه بودن خصوصیات نمونه مورد بررسی مشکل خواهد بود و روش های استاندارد اغلب در بررسی این مورد به بن بست می رسند (Sibbertsen, 2004).

در چنین مواردی، زمانی که فقط حافظه بلندمدت در سری زمانی تحت بررسی وجود داشته باشد، شیوه های تشخیص شکست ساختاری، یک یا چند نقطه شکست را گزارش می دهند. بطور مشابه، زمانی که فقط شکست های ساختاری در سری زمانی وجود داشته باشد، تکنیک های حافظه بلندمدت، اغلب وجود حافظه بلندمدت را نشان می دهند. بر این مبنای در صورت قبول فرض اینکه، حافظه بلندمدت مشاهده شده در سری های زمانی، یک خطای ایجاد شده توسط سطح انتقال ها است، می توان گفت که شوک های نادر معدودی، ماندگاری خاص حافظه بلندمدت را القاء می کنند؛ در حالیکه، اکثر شوک ها به سرعت محو می شوند (در نقطه مقابل، در مدل حافظه بلندمدت، همه شوک ها ماندگاری یکسانی را دارا هستند). با توجه به آنچه شرح داده شد، تمایز بین حافظه بلندمدت و سطح انتقال ها و یا به عبارتی، تشخیص صحیح حافظه با توجه به نقاط شکست، به طور چشمگیری می تواند تجزیه و تحلیل رویه و عملکرد پیش بینی سری های زمانی، بویژه سری های مالی را، بهبود بخشد.

بر این اساس، هدف مطالعه حاضر، کاربرد استراتژی ایی در جهت استنباط صحیح حافظه بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) می باشد. برای دستیابی به هدف مذکور، ابتدا پارامتر حافظه TEPIX را با استفاده از روش های تخمین حافظه بلندمدت نیمه پارامتریک و پارامتریک، بدون توجه به نقاط شکست، تخمین خواهیم زد. در گام بعدی، نخست با استفاده از روش OLS مبنی بر مجموع انباشته ($CUSUM^1$) و آزمون SupF، به بررسی فرض صفر، یعنی عدم وجود ساختاری پرداخته شده و سپس، برای بررسی دقیق تر، نقاط شکست چندگانه زمانی ناشناخته (از پیش تعیین نشده) با استفاده روش بای و پرون² (۱۹۹۸، ۲۰۰۳) برآورد می گردد. در نهایت، با توجه به ویژگی های آماری قبل و بعد نقاط شکست ها و همچنین برآورد پارامتر حافظه TEPIX در درون خرده سری های تشخیص داده توسط شکست ها، بینش صحیحی در مورد حافظه بازار بدست خواهد آمد. البته برای اطمینان بیشتر از نتایج، از آزمون GPH تعدل

شده اسمیت (۲۰۰۵) نیز استفاده می‌شود. از این رو، مسئله و سوال تحقیق این است که: آیا حافظه بازده TEPIX تحت تاثیر شکست‌های ساختاری می‌باشد؟

۲- مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

طی دهه‌های اخیر فرایندهای حافظه بلندمدت بخش اساسی و مهمی از تحلیل سری‌های زمانی بخصوص کاربرد آن در جهت تحلیل سری‌های زمانی مالی را به خود اختصاص داده‌اند. فرایندهای حافظه بلندمدت را می‌توان بصورت وابستگی مشاهدات به سبب کاهش هیپربولیکی^۳ تابع خود همبستگی^۴ یا با یک چگالی طیفی در فرکانس λ که متناسب است با λ^{2-d} در حالی که λ به صفر نزدیک می‌شود، تشخیص داد. به طوری که $0 < d < 1$ نمایانگر پارامتر حافظه است. مدل‌های حافظه بلندمدت در واقع جایگاهی بین حافظه کوتاه مدت و خصوصیات ریشه واحد را در بردارد. از این رو، قابلیت افزون تری در جهت مدل سازی ماندگاری سری‌های زمانی را دارا می‌باشند.

در این راستا، تئوری‌های متفاوت و گستردهای برای برآورد فرایندهای حافظه بلندمدت شکل گرفته‌اند که در میان آنها، می‌توان به مطالعات مندلبروت و والیس^۵ (۱۹۶۹)، گرنجر و جویکس^۶ (۱۹۸۰)، هاسکینگ^۷ (۱۹۸۱)، جووک و پورتر-هوداک^۸ (۱۹۸۳)، لو^۹ (۱۹۹۱)، سوول^{۱۰} (۱۹۹۲)، چونگ و دایبولد^{۱۱} (۱۹۹۴)، رابینسون^{۱۲} (۱۹۹۵)، انگل و اسمیت^{۱۳} (۱۹۹۹) و دیتمن و گرنجر^{۱۴} (۲۰۰۲) اشاره داشت که بیشتر تمرکز آنها بر آزمون و تخمین چنین مدل‌هایی بود و در این حوزه اخیراً، دورنیک و اوومس^{۱۵} (۲۰۰۳) رویه‌ی پایه راست نمایی^{۱۶} را بهبود بخشیدند. هر چند که از جنبه دیگر، مطالعات لیو^{۱۷} (۲۰۰۰)، گرنجر و دینگ^{۱۸} (۱۹۹۶)، گرنجر و هیونگ^{۱۹} (۱۹۹۹)، بریدتو هوسو^{۲۰} (۲۰۰۲)، هیدالگو و رابینسون^{۲۱} (۱۹۹۶) اشاره بر این دارند که حافظه بلندمدت مشاهده شده در بسیاری از سری‌های زمانی، یک خطای ایجاد شده توسط سطح انتقال‌ها است. بنابراین، علت وجود تورش و یا اریب در تخمین حافظه بلندمدت را می‌توان در جستجوی ویژگی‌های فرایندهای حافظه بلندمدت مانند چگالی طیفی و کاهش بسیار آهسته هیپربولیکی تابع خودهمبستگی در وقفه‌های طولانی دانست؛ به طوریکه، همین ویژگی‌ها را می‌توان در فرایندهای حافظه کوتاه مدت که تحت تاثیر گرایش‌ها یا شکست ساختاری هستند، یافت (Smith, 2005). بالطبع، این امر منجر به فرایندهای حافظه بلندمدت جعلی در سری زمانی خواهد شد. در حقیقت شواهدی وجود دارد که فرایندهای حافظه کوتاه مدت ایستا با نقاط شکست در میانگین می‌توانند نرخ آهسته کاهش در تابع خودهمبستگی و دیگر خصوصیات فرایندهای انباشته کسری را نشان دهد. به طوری که یک سری زمانی با داشتن نقاط شکست، ماندگاری قوی‌ای را در تابع خودهمبستگی ایجاد می‌کند که رفتار

فرایнд حافظه بلندمدت در آن مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، فرایندهای حافظه بلندمدت ممکن است به شناخت جعلی نقاط شکست منجر شود (Yusof et al., 2013). از جمله تحقیقات دیگر در این زمینه، عبارتند از:

لوبوت و ساوین^{۲۲} (۱۹۹۸) بررسی کردند که شواهد جعلی حافظه بلندمدت ممکن است به علت بازده نایستا و ابلاشتگی سری زمانی باشد. تیلور^{۲۳} (۲۰۰۰) دریافت که اتخاذ حافظه بلندمدت اثر معناداری بر ساختار نوسان دارد. او هانیسیان و همکاران^{۲۴} (۲۰۰۴) نشان دادند وقتی فرایند تولید داده حافظه بلندمدت جعلی باشد، استفاده از مدل حافظه کوتاه مدت یا مدل حافظه بلندمدت حقیقی، منجر به این می‌شود که اختیارها^{۲۵} کمتر از آنچه ارزش دارند، قیمت گذاری شوند. در مقابل، زمانی که فرایند تولید داده‌ها، حافظه بلندمدت حقیقی باشد، کاربرد مدل حافظه کوتاه مدت یا مدل حافظه بلندمدت جعلی منجر به قیمت‌گذاری بیش از آنچه اختیارها ارزش دارند، خواهد شد. دیپولد و اینو^{۲۶} (۲۰۰۱) پی برندند که نقاط شکست می‌تواند حافظه بلندمدت جعلی را القاء کند. به بیانی دیگر، آنها نشان دادند که سری‌های زمانی که فقط حاوی نقاط شکست هستند، می‌توانند با حافظه بلندمدت اشتباه گرفته شوند؛ به فرض اینکه احتمال وجود نقاط شکست با افزایش اندازه نمونه کاهش می‌یابد. ساکولیس و ذیوت^{۲۷} (۲۰۰۱) شواهدی ارائه دادند که با تشخیص صحیح نقاط شکست چندگانه در میانگین، ماندگاری سری بطور اساسی کاهش می‌یابد. اسمیت^{۲۸} (۲۰۰۵) در مطالعه‌ی خود با ارائه تخمین زن تعديل شده GPH^{۲۹} به این استدلال رسید که مدل حافظه کوتاه مدت با سطح انتقال‌ها باید به عنوان یک جایگزین^{۳۰} برای حافظه بلندمدت مطرح شود. در مطالعه‌ی دیگر چوی و ذیوت^{۳۱} (۲۰۰۷) به این مورد اشاره داشتند که خصوصیت حافظه بلندمدت در نوسان بازده توسط شکست‌های ساختاری قابل توضیح است. از سوی دیگر، دیپور و همکاران^{۳۲} (۲۰۰۸) با کاربرد نوسانات تحقق یافته S&P100 گزارش دادند که سطح انتقال‌ها، علتی برای توصیف حافظه بلندمدت در داده‌ها نمی‌باشد.

در زمینه تحقیقات داخلی، عموم مطالعات به تشخیص یا مدلسازی فرایند حافظه بلندمدت در مطالعات خود تاکید نموده اند و تحقیقی در زمینه تشخیص صحیح حافظه بازار اوراق بهادار تهران یا سری زمانی دیگر انجام نشده است. عنوان مثال، عرفانی (۱۳۸۷) وجود حافظه بلندمدت را با استفاده از سه روش DFA، کلاسیک R/S و MRS شاخص کل بورس اوراق بهادار ارزیابی کرد که نتایج هر سه آزمون وجود حافظه بلندمدت را تایید می‌کرد. وی در تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۸ دقت پیش‌بینی مدل‌های ARFIMA را با مدل‌های ARIMA مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که دقت مدل ARFIMA در پیش‌بینی شاخص بیشتر است. محمودی و همکاران (۱۳۸۹) با استفاده از روش‌های مختلف تخمین پارامترهای مانند R/S، MRS، EML، NLS و Whittle

Wavelet به برآورد حافظه بلندمدت در بازار های جهانی نفت پرداختند. کشاورز و صمدی (۱۳۸۸) نشان دادند که انجام پیش بینی در دوره‌ی خارج از دوره‌ی نمونه ARFIMA-FIGARCH با توزیع نرمال نسبت به توزیع Student-t دقیق‌ترین مدل بوده و نتایج بهتری را ارائه می‌دهد.

۳- روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است؛ زیرا به بررسی مشاهدات در سری زمانی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در جهت استنباط صحیح حافظه بازده TEPIX می‌پردازد. همچنین، از جنبه اجرا و روش گردآوری داده‌ها، تحقیقی توصیفی - پیمایشی (از نوع مقطعی) می‌باشد. داده‌های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل موضوع، داده‌های شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که مربوط به کلیه شرکتهای پذیرفته شده در آن بوده و از نرمافزار رهآوردنوین برای بازه زمانی ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ الی ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ (شامل ۲۶۶۷ مشاهده)، استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، با توجه به حجم وسیع داده‌ها و ضرورت پردازش آنها برای برآورد آمارهای توصیفی، پارامترهای مدل تحقیق و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری از تکنیک‌های جاری اقتصاد سنجی تحت نرم افزارهای Eviews و Oxmetric/pccgive و R استفاده گردید. بدین صورت که، از آزمون‌های OLS مبنی بر SupF، CUSUM و بای و برون (۲۰۰۳، ۱۹۹۸) برای تشخیص و شناسایی نقاط شکست ساختاری و از رویه‌های نیمه پارامتریک GPH و GSP و همچنین از روش تخمین پارامتریک CML برای آزمون انباشته کسری استفاده شده است.

۴- مدل‌های پژوهش و نحوه‌ی اجرای آن

۴-۱- تحلیل آماری فرایند کسری

طبق مطالعه اوومس و دورنیک (۲۰۰۴)، فرایند کسری ARFIMA(p,d,q) بصورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}\Phi(L)(1-L)^d(y_t - m_t) &= \Theta(L)\varepsilon_t \\ \Phi(L) &= (1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p) \\ \Theta(L) &= (1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q) \\ t &= 1, 2, \dots, T,\end{aligned}$$

که L به عملگر وقفه اشاره دارد و $\Phi(L) = (1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p)$ و $\Theta(L) = (1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q)$ به ترتیب، نمایانگر چند جمله‌ای خودرگرسیون (AR) و میانگین متحرک (MA) هستند. جمله

خطای خالص ϵ_t متغیری تصادفی با توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس واحد فرض شده است؛ در حالیکه، پارامتر d عددی طبیعی است که $(1-L)^d$ -نمایانگر پارامتر تفاضل گیری جزئی مدل می باشد و با استفاده از یک سری دو جمله ای بصورت زیر، قابل تجزیه است:

$$(1-L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-L)^k = 1 - dL + \frac{d(d-1)}{2!} L^2 - \dots$$

همچنین فرض شده است که: $(y_t - m_t) = z_t$ ، ریشه های $\Theta(L) = 0$ و $\Phi(L) = 0$ خارج از دایره واحد می باشند و ریشه های مشترکی ندارند. بعلاوه، قسمت ARMA مدل ARFIMA(p, d, q) ایستا و معکوس پذیر است. همانطور که پارامترهای p و q انعطاف بیشتری به خصوصیات کوتاه مدت مدل سازی می دهد (زمانی که p و q برابر صفر باشند)، y_t نشان دهندهی فرایند نوفه کسری ساده خواهد بود، پارامتر d رفتار z_t را تعیین می کند و در این حالت، خصوصیات سری زمانی z_t وابستگی زیادی نسبت به پارامتر d از خود بروز می دهد. طبق مطالعه هاسکینگ (۱۹۸۱)، اگر $0 < d < 0/5$ - باشد، فرایند z_t دارای حالت ایستایی کواریانس بوده و بدین ترتیب، $0 < d < 0/5$ دلالت بر فرایند حافظه بلندمدت دارد و $1 < d < 0/5$ حالت برگشت به میانگین را بدون در نظر گرفتن ایستایی کواریانس برای z_t نمایان می سازد. زمانی که $0 < d < 0/5$ باشد، در وقفه های بالا، کاهش هیپربولیکی در تابع اتوکواریانس آشکار می شود. چنانچه γ_k نشان دهندهی تابع اتوکواریانس باشد، کاهش هیپربولیکی در رابطه $\sim ck^{2d-1}$ به خوبی نمایان می شود؛ به شرطی که $k \rightarrow \infty$ و $c > 0$ باشد. به ازای $0 < d < 0/5$ - مجموعه قدر مطلق خودهمبستگی فرایند، طبق رابطه $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=-n}^n |\rho_j|$ به یک مقدار ثابت میل می کند و ویژگی حافظه کوتاه مدت را برای سری زمانی z_t نمایان می سازد. در این وضعیت، ARFIMA($0, d, 0$) ویژگی ناماندگاری^{۳۵} یا حافظه میان مدت^{۳۶} را آشکار می سازد و همه خودهمبستگی های این فرایند، بجز وقفه صفر، منفی و کاهش هیپربولیکی به صفر خواهند داشت.

۱-۱-۴- روش های آزمون فرایند کسری

در این بخش برای آزمون انباسته کسری، از روش های نیمه پارامتریک GPH و GSP^{۳۷} و همچنین از روش تخمین پارامتریک CML^{۳۸} استفاده خواهد شد.

۱-۱-۴- روش GPH

روش GPH مبتنی بر دامنه فرکانس است. در چارچوب تحلیل طیفی و دامنه فرکانس، سری های زمانی مشاهده شده به عنوان جمع موزونی از سری های پایه ای است که الگوهای ادواری

مختلفی دارند. تکنیک دوره نگاشت ابزاری برای تمایز بین روندهای کوتاه مدت و حافظه بلندمدت فراهم می‌آورد. تخمین زننده دوره نگاشت^{۳۹} برای تخمین پارامتر حافظه، توسط جووک و پورتر هوداک (۱۹۸۳) ارائه شد و بطور خلاصه به تخمین زن GPH معروف است (محمدی و طالبلو، ۱۳۸۹). ایده روش GPH بدین صورت است که تابع چگالی طیفی، توسط دوره نگاشت با استفاده از تعریف $c\lambda^{-2d}$ در حالی که $\lambda \rightarrow 0^+$ ، تخمین زده می‌شود. تخمین زن رگرسیون اصلاح شده لگاریتم نگاشت، از جووک و پورتر-هوداک (۱۹۸۳) بر اساس رابطه زیر است:

$$\log I(\lambda_j) = \log f_u(0) - d \log |1 - e^{i\lambda_j}|^2 + \log [I(\lambda_j) / f(\lambda_j)] + \log [f_u(\lambda_j) / f_u(0)]$$

که در آن $I(\lambda_j) = \left| T^{-1} \sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y}) e^{it\lambda_j} \right|^2$ فوريه تعريف شده است؛ در حالی که $f(\lambda) = \log I(\lambda)$ دوره‌ی نگاشت تابع $f(\lambda)$ می‌باشد که بر حسب فرکانس $m = [(T-1)/2], j = 1, 2, 3, \dots, m$ و $\lambda_j = 2\pi j/T$ ، $\lambda_j \in (0, \pi)$ می‌باشند. همچنین در معادله‌ی $f_u(\lambda) = (1-L)^d y_t$ تابع چگالی y_t بوده که توسط $f_u(\lambda) = (\sigma^2 / 2\pi) \left(|\theta(e^{-i\lambda})|^2 / |\phi(e^{-i\lambda})|^2 \right)$ مفروض است. معادله‌ی بالا را می‌توان به عنوان یک رگرسیونی خطی ساده به صورت زیر نوشت:

$$z_j = c - dx_j + \varepsilon_j \quad j = 1, 2, 3, \dots, m$$

که در آن $c = \log f_u(0)$ می‌باشد. پارامتر تفاضل جزئی d می‌تواند توسط رگرسیون حداقل مربعات خطی z_j بر x_j با توجه به $j = 1, 2, 3, \dots, m$ تعیین زده شود. در اینجا m تابعی از T می‌باشد ($m = g(T) = T^\alpha$ در ازاء $0 < \alpha < 1$ ؛ چنانچه $m/T \rightarrow 0$ ، هنگامی که $T \rightarrow \infty$). در ضمن، محور افقی حداقل مربعات تخمین زننده d بطور مجانبی در ازاء استاندارد خطای $\pi(6m)^{-1/2}$ نرمال است.

این نوع تخمین زن همانطور که اگیاکلوگلو و همکاران^{۴۰} (۱۹۹۲) نشان دادند، زمانی که ضریب خطای AR و یا MA برابر یک باشد، ناکارامد و دارای اربی خواهد بود. به علاوه، بدلیل اینکه GPH تنها بواسطه‌ی $|d| < 1/2$ مستحکم و مستدل می‌باشد، به خوبی خصوصیات مجانبی را در بر نمی‌گیرد. اسمیت (۲۰۰۵) تعدیلی در برابر تخمین زن GPH پیشنهاد داد که با اضافه کردن یک رگرسیون اضافی $-\log(p^2 + \lambda^2)$ به رگرسیون GPH انجام می‌پذیرد. بر این مبنای، اربی که توسط سطح انتقال‌ها پیش می‌آید، کاهش پیدا می‌کند. نظر به اینکه p (سطح ماندگاری)

نامشخص است، اسمیت (۲۰۰۵) یک تخمین زنی را که توسط $p_T = kJ/T$ برای بعضی از مقادیر ثابت $k > 0$ ایجاد می‌شود را استنتاج کرد.^{۴۱}

۱-۱-۴- نگرش Local Whittle: تخمین زن

کلاس دیگری از تخمین زن نیمه پارامتریک در حوزه‌ی فرکانس، تخمین زن Local Whittle می‌باشد که پیرو نگرش Local Whittle، توسط کوستنج^{۴۲} (۱۹۸۷) مطرح شد. رابینسون^{۴۳} (۱۹۹۵) نوع دیگری از این تخمین زن را ارائه داد که بواسطه نوع بیان راست نمایی، خصوصیات مجانبی مطلوب و فرضیاتش، مورد توجه قرار گرفت. این تخمین زن به نام تخمین زن نیمه پارامتریک نیمه گاوی (GSP) شناخته شده است. تخمین زن GSP شبیه تخمین زن GPH بر اساس دوره نگاشت و با استفاده از تعريف $c\lambda^{-2d}$ در شرایط $\lambda \rightarrow 0^+$ طراحی شده است. همچنین GSP مانند GPH شامل پارامتر اضافی m است که می‌تواند کمتر یا مساوی $[T-1]/2$ قرار بگیرد و با استفاده از شرایط $T \rightarrow \infty$ و $m \rightarrow 0$ است. GSP را توسط مینیمم کردنتابع زیر بدست می‌آورد:

$$r(d) = q(\hat{g}, d) - 1 = \log m^{-1} \sum_{j=1}^m \frac{I(\lambda_j)}{\lambda_j^{2d}} - 2dm^{-1} \sum_{j=1}^m \log \lambda_j$$

که $\hat{g} = m^{-1} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)$ در ازای $q(\hat{g}, d) = m^{-1} \sum_{j=1}^m \left(\frac{I(\lambda_j)}{\hat{g} \lambda_j^{2d}} + \log \hat{g} \lambda_j^{-2d} \right)$ می‌باشد. ارزش \hat{d} که

مینیمم تابع $r(d)$ است، وقتی که $T \rightarrow \infty$ می‌رود، به ارزش واقعی d همگرا می‌شود. همچنین، رابینسون (۱۹۹۵) نشان داد که وقتی $d \in (-1/2, 1/2)$ باشد، $(\hat{d} - d) \in m^{1/2}$ به سمت $N(0, 1/4)$ همگرا خواهد شد. بنابراین، با توجه به فرضیات تحت GSP که منطقی تر از Hستند، توزیع مجانبی GSP، بشدت ساده، استنباط مجانبی آن آسان و در کل، کاراتر از تخمین زن GPH خواهد بود. تنها اشکال GSP در مقایسه با GPH را می‌توان در لزوم بهینه سازی عددی این نوع تخمین زن دانست. در پی توسعه GSP، رابینسون و هنری^{۴۴} (۱۹۹۸) این تخمین زن را در صورت بودن خصوصیات ناهمگنی پراکنشی^{۴۵} شرطی (تحت شرایط با قاعده بواسطه‌ی شکل کلی ناهمگنی پراکنشی شرطی رابینسون^{۴۶} (۱۹۹۱)) در سری‌ها بسط و تئوری مجانبی حافظه بلندمدت را با در نظر گرفتن ساختار ARCH گسترش دادند. بنابراین با وجود ناهمگنی پراکنشی شرطی در سری، استفاده از روش‌های دیگر شبیه GSP، باعث ناسازگاری نتایج تخمین خواهد شد.

از مباحث مهم در برآورد آزمون‌های GSP و انتخاب پارامتر پهنه‌ای باند m می‌باشد. بهطوری‌که جووک و پورتر-هوداک (۱۹۸۳) مرتبه‌ی پهنه‌ای باند $T^{0.5}$ را بواسطه‌ی ایستایی d برای GPH پیشنهاد دادند. هوریچ و دیگران^{۴۷} (۱۹۹۸) این مرتبه را بر اساس مینیمم سازی میانگین

خطای مربعات $T^{0.8}$ در نظر گرفتند. در کل، مقدار بزرگتر m, \hat{d} را سریع‌تر به d همگرا می‌کند و از سوی دیگر اگر سری زمانی از نظر حافظه بلندمدت ایده آل نباشد و یا به عبارتی، حاوی فرایند ARFIMA(p,d,q) باشد، بطوریکه $p = q$ یا هر دو برابر صفر نباشند، باید ارزش کوچکی را برای m انتخاب کرد. نظر به اینکه، در فرکانس‌های بالا، رفتار کوتاه مدت سری بر شکل چگالی طیفی اثر گذار است (Balcić et al., 2002).

۱-۱-۴- نگرش پارامتریک مدل ARFIMA بر اساس CML

در مباحث اقتصاد سنجی از جمله روش‌های برآوردهای پارامتریک فرایند تفاضل کسری ARFIMA، برآوردهای خداکثرا راست نمایی دقیق (EML)^{۴۷} و ماکزیمم راست نمایی شرطی (CML) می‌باشند که به ترتیب توسط سوول^{۴۸} (۱۹۸۷) و روشهایی که بران^{۴۹} (۱۹۹۵) بر اساس آن، تخمین زن ماکزیمم تقریبی راست نمایی را بر پایه‌ی مینیمم مجموعه مربعات شرطی توسعه داده شده است، مطرح گشته‌اند. بران (۱۹۹۵)، کارایی مجانبی و به هنجاری نتایج تخمین زننده‌های پارامترهای (ϕ, θ, d) را اثبات نمود و محققانی مانند بوردیگه و اویکل^{۵۰} (۱۹۹۳) و چانگ و بایلی^{۵۱} (۱۹۹۳) با توجه به نتایج تخمین مونت کارلو^{۵۲} روش برآوردهای CML را یک تخمین زن مناسب برای مدل‌های ARFIMA(0,d,0) می‌دانند. تکنیک CML برخلاف روش EML احتیاجی به پیش‌فرض نمایی ($d < 0/5$) نخواهد داشت و همچنین محاسبه‌ی آسان‌تر آن نسبت به تکنیک EML در برآوردهای CML را تکنیکی دقیق‌تر از تکنیک EML معرفی کرده است. لگاریتم تقریبی راست نمایی CML به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$L_C(d, \phi, \theta, \mu) = -\frac{T}{2} \ln \left[\sum_{t=1}^T \left(\frac{\phi(L)}{\theta(L)} (1-L)^d (y_t - \mu)^2 \right) \right]$$

۲-۴- تشخیص و تعیین شکست ساختاری

در صورتی که با توجه به شرایط و مقتضیات حاکم بر متغیرهای اقتصادی، تغییر در روند متغیرها همراه تغییر در پارامترهای مدل صورت بگیرد؛ و یا به بیان دیگر، اگر در پایداری پارامترهای یک مدل خللی حاصل شود، این تغییرات را شکست ساختاری گویند (مرزبان و نجاتی، ۱۳۸۸). در مطالعات اولیه آزمون شکست ساختاری در مدل‌های رگرسیون خطی در یک نقطه زمانی از پیش تعیین شده و به صورت بروز را انجام می‌گرفت (Chow, 1960 and Brown et al., 1975). اما اخیراً روش‌های آزمون شکست ساختاری به‌طور درون‌زا و در نقطه‌یا نقاط از پیش تعیین شده انجام می‌گیرد (Bai and Perron, 1998-2003; Andrews et al., 1996 and Andrews, 1993). در این مطالعه، به ترتیب از روش OLS مبنی بر CUSUM، آزمون SupF و Andrews, 1993

روش بای و پرون (۱۹۹۸، ۲۰۰۳) برای تشخیص و شناسایی نقاط شکست ساختاری استفاده خواهد شد.

۴-۲-۴-آزمون OLS مبنی بر CUSUM

پلوبرگر و کرامر^{۵۳} (۱۹۹۲) بر اساس آزمون تغییر ساختاری مجموع انباشته باقیمانده های معروف OLS، روش CUSUM را پیشنهاد دادند. فرایند نوسان تجربی (cfp)^{۵۴} OLS مبنی بر CUSUM بصورت زیر تعریف می شود:

$$W_n^0(t) = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{[nt]} \hat{u}_i, \quad (0 \leq t \leq 1),$$

که $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}$ جزو صحیح nt می باشد. همچنین \hat{u}_i نشان دهنده باقیمانده های OLS است. مسیر فرایند $(W_n^0(t))$ همواره با صفر در $t = 0$ شروع خواهد شد و این

فرایند به جهت $t = 1$ به صفر بازگشت پیدا می کند. اما در صورت وجود تغییر ساختاری در t_0 ، مسیر $(W_n^0(t))$ مقدار حداکثری در محدوده i نقطه شکست t_0 خواهد داشت. در این آزمون، فرض عدم وجود تغییر ساختاری در صورتی رد می شود که فرایند تجربی نوسان در مقایسه با فرایند محدود نوسان که توسط کرانه های λ و $-\lambda$ در سطح اطمینان α مشخص می شوند، بطور غیر محتمل بزرگ باشد. بنابراین، اگر فرایند تجربی نوسان از محدوده کرانه λ و $-\lambda$ عبور کند، می توان استنباط کرد که فرایند نوسان تجربی به طور غیر محتمل بزرگ است و فرض صفر در سطح اطمینان α رد می شود. همچنین، فرض صفر آزمون، زمانی که آماره $SupF = \max_{1 \leq i \leq T} F_i$ بزرگتر از ارزش بحرانی که در مطالعه اندروز^{۵۵} (۱۹۹۳) گزارش شده بزرگتر باشد، پذیرفته نمی شود. در اینجا F_t آماره متداول محاسبه شده در نقطه شکست t می باشد.

۴-۲-۴-روش بای و پرون

در ابتدا فرض می شود که تعداد $(m+1)$ رژیم سیاستی وجود داشته باشد که در نتیجه، m تغییر ساختاری وجود خواهد داشت. بنابراین رگرسیون خطی دارای m شکست (در این پژوهش، m نقاط شکست مجاز فرض شده و برابر ۵ و با ارزش ترايمينگ^{۵۶} ۱۵٪ تعیین گردیده است) و $m+1$ دسته پارامتر خواهد داشت که نمایش آماری آن به صورت زیر است:

$$y_t = x'\beta + z'_j \delta_j + u_t,$$

که $t = T_{j-1} + 1, \dots, T_j$ بوده، به طوری که $j = 1, \dots, m+1$ می باشد. در اینجا، متغیرهای T_0 و T_{m+1} به ترتیب برابر صفر و T در نظر گرفته شده است. در این مدل، y_t متغیر وابسته در زمان t ،

($p \times 1$) x_t و ($q \times 1$) z_t بردارهای کووریت δ^y متغیر y_t می‌باشند. β و ($j = 1, \dots, m+1$) هم نشان دهنده‌ی بردار ضرایب خواهد بود و u_t جزء خطأ در زمان t می‌باشد. در این آزمون همانطور که ذکر شد، شاخص‌ها (T_1, \dots, T_m) یا نقاط شکست، از پیش تعیین نشده (ناشناخته) تلقی شده‌اند. از این‌رو، هدف اصلی این است که ضرایب و نقاط شکست نامشخص رگرسیون را وقتی که T مشاهده از (y_t, x_t, z_t) موجود است، تخمین زده شود؛ به‌طوری‌که اگر $p=0$ مدل شکست ساختار خالص باشد، یعنی همه ضرایب با ($j = 1, \dots, m+1$) δ_j تغییر پیدا می‌کند، در غیر این صورت ($p > 0$)، مدل با شکست جزئی می‌باشد؛ چون فقط δ_j ‌ها تغییر پیدا می‌کنند، درحالیکه β ثابت فرض شده است. روش تخمین متغیرها بر اساس اصول حداقل مربعات است؛ به‌طوری‌که برای هر m -بخش (T_j, \dots, T_m)، $\{T_1, \dots, T_{j-1}\}$ مشخص شده است که متکی به تخمین حداقل مربعات β و δ_j می‌باشد و توسط مینیمم کردن مجموع مربع باقیمانده‌ها $\sum_{i=1}^{m+1} \sum_{t=T_{j-1}-1}^{T_j} [y_t - x'_i \beta - z'_i \delta_j]^2$ بدست می‌آید.

در ادامه با جایگزین کردن نتایج تخمین ($\hat{\beta}$ و $\hat{\delta}_j$) در تابع هدف و با در نظر گرفتن نتایج مجموع پسماندها مربع شده (RSS^{Δ}) به عنوان ($S_T(T_1, \dots, T_m)$ ، تخمین نقاط شکست به صورت زیر می‌باشد:

$$(\hat{T}_1, \dots, \hat{T}_m) = \arg \min_{(\hat{T}_1, \dots, \hat{T}_m)} S_T(T_1, \dots, T_m)$$

که همه بخش‌های میسر (T_1, \dots, T_m) را می‌سازی خواهد کرد؛ به‌طوری‌که $T_i - T_{i-1} \geq q$ می‌باشد. برای تکمیل شدن این فراینده، پژوهش حاضر در پرتو m تغییر ساختار که معادل ۵ (T₅) آن را مجاز دانست، تعداد نقاط شکست را توسط معیار BIC با توجه به روش تخمین نقاط شکست بای و پرون (۲۰۰۳، ۱۹۹۸) انتخاب می‌گردد.

۵- نتایج پژوهش

۱-۵- ویژگی‌های آماری متغیر پژوهش

داده‌هایی که در پژوهش حاضر برای مدلسازی در بورس به کار برده شده است، شاخص قیمت بورس تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ تا ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ بوده که شامل ۲۶۶۷ مشاهده می‌باشد. در این قسمت برای محاسبه بازده شاخص کل از لگاریتم درصد تغییرات $\left(r_t = \log\left(\frac{p_t}{p_{t-1}}\right) \times 100 \right)$

استفاده شده که p_t ، مقدار شاخص قیمت بورس در زمان t است. در تجزیه و تحلیل مقدماتی طبق جدول شماره ۱، آماره‌های چولگی و کشیدی اضافی نشان دهنده‌ی این مورد است که سری بازده،

دارای توزیع دنباله پهن‌تر و راس بالاتری نسبت به توزیع نرمال می‌باشد. آنچنان که آماره جارک-برا (J-B)^{۵۹} برای بازده لگاریتمی رد شدن فرض نرمال بودن توزیع بازده‌ها را در پی دارد.

جدول شماره ۱- آماره توصیفی بازده TEPIX

تعداد مشاهدات	۲۶۶۷
میانگین	۰۰۹۰۰۹۷
انحراف معیار	۰۶۱۷۶۲
چوگانگی	۰.۳۹۷۷۶**
کشیدگی اضافی	۱۰.۶۹۶**
مینیمم	-۵.۴۵۰۳
ماکزیمم	۵.۲۶۰۸
J-B	۱۲۷۸۴.۰ **
$Q(20)$	۱۲۳۵.۵۱*
$Q_s(20)$	۳۷۵.۵۴۵*
ARCH (5)	۳۲.۵۸۳*

توضیحات: J-B ارزش آماره جارک-برا باقیمانده‌های بازده را نشان می‌دهد.
 $Q(20)$ و $Q_s(20)$ آماره آزمون باکس-پیرس را به ترتیب برای باقیمانده بازده و باقیمانده مربعات بازده تا مرتبه ۲۰ سریال همبستگی بیان می‌کنند.
ARCH(5) نمایانگر آماره-تی شاخص آزمون ARCH می‌باشد.
** و * به ترتیب نشان دهنده‌ی رد معناداری فرض صفر آزمون‌ها در سطح معنی‌داری ۹۵٪ و ۹۰٪ می‌باشند.

برای آزمون فرضیه صفر مبتنی بر نویه‌ی سفید بودن ϵ_t از آماره‌های باکس-پیرس^{۶۰} باقیمانده‌های بازده ($Q(20)$) و مربع باقیمانده‌های بازده ($Q_s(20)$) استفاده می‌گردد که به ترتیب هر کدام دارای توزیع مجانبی و خی دو (χ^2) با ۲۰ درجه آزادی می‌باشند. باقیمانده‌های بازده و مربع باقیمانده‌های بازده این آزمون برای در برداشتن فرایند I.I.D و مستقل، رد می‌شوند و از این رو، باقیمانده‌های مربع و بازده، تا وقفه ۲۰ همبستگی بسیار بالایی دارند. در این خصوص آماره‌ی ($Q_s(20)$) بشدد بالا می‌باشد که نشان دهنده‌ی نفوذ فراگیر تلاطم خوشه‌ای در بازار سرمایه است. همانطور که آزمون مربوط به نشانه‌های ARCH (آزمون ضرایب لاغرانز (LM)^{۶۱}) این ویژگی را مورد تایید قرار می‌دهد.

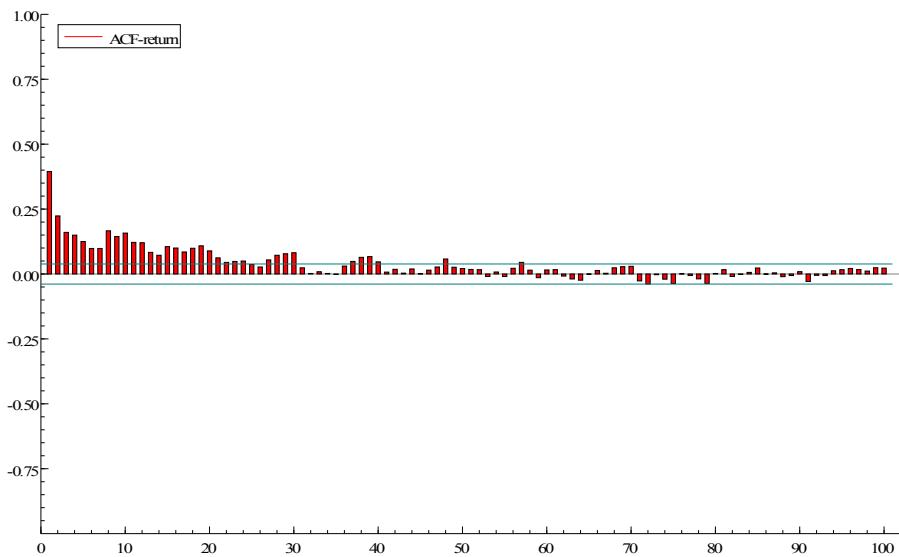
جدول شماره ۲- آزمون های ریشه واحد برای بازده TEPIX

آماره ها	مقادیر تخمین زده
ADF	-۱۲.۵۶۰۶۹(Y)****
PP	-۴۱.۶۶۴۸۱(۲۷)****
KPSS	.۲۶۱۸۸۲(۳۰)****

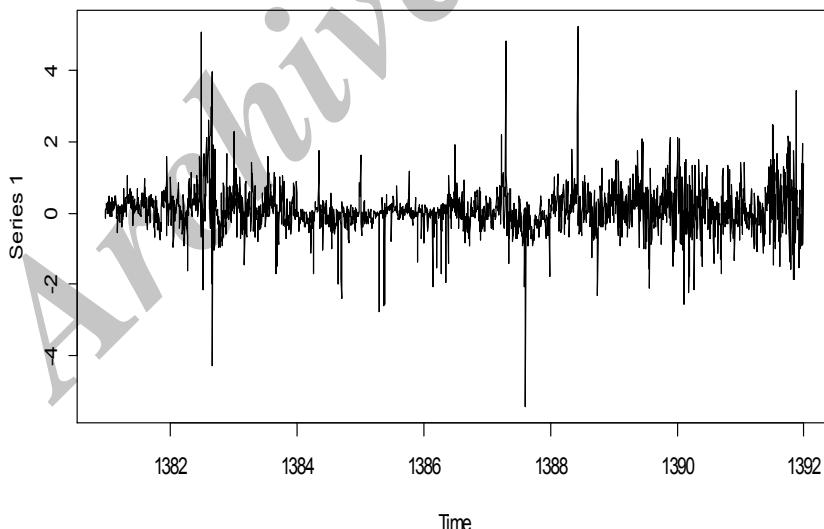
توضیحات: ارزش حیاتی ۱٪ مکنیان ۶۲ برای آزمون ADF و PP برابر با ۳.۴۳۵- است. برای آزمون KPSS ارزش حیاتی ۰.۷۳۹ برابر با سطح معنی داری ۹۹٪ می باشد. اعداد داخل پرانتز به ترتیب نمایانگر وقفه دوره ها و پهنانی باند برای آماره ADF و آماره های PP و KPSS می باشد.

*** نشان دهنده رد معناداری فرض صفر آزمون ها در سطح معنی داری ۹۹٪ می باشد.

همچنین با انجام آزمون های ایستایی (جدول شماره ۲) که توسط آماره دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF)، آماره فیلیپس- پرون (PP)، آماره کوویت کووسکی- فیلیپس- اشمیت- شین (KPSS)^{۶۳} در سطح معنی داری ۹۹٪ صورت گرفته، فرض صفر این سه آزمون (فرض صفر دو آزمون ADF و PP وجود ریشه واحد می باشد؛ در حالی KPSS فرض صفر مبنی بر عدم وجود ریشه را دارا می باشد) رد می شود. طبق مطالعات بایلی و همکاران^{۶۴} (۱۹۹۶)، رد شدن هر دو آماره PP و KPSS حاکی از این است که فرایند نه توسط (0) I و نه توسط (1) II توصیف می شود، بنابراین چنین فرایندی ممکن است توسط فرایند کسری جزیی بهتر توصیف شود. بعلاوه، شکل شماره ۱ تابع خودهمبستگی TEPIX را نشان می دهد که کاهش خودهمبستگی در حالی که وقفه ها افزایش می یابد، خیلی کند می باشد و تا حد زیادی از ویژگی تابع هیبروبولیک پیروی می کند که بنابر ادبیات موجود نشانگر وجود حافظه بلندمدت خواهد بود و از سوی دیگر خط سیری سری بازده TEPIX (شکل شماره ۲) وجود تغییرات میان بعضی رژیم ها را نمایان می سازد.



شکل شماره ۱: تابع خودهمبستگی ACF



شکل شماره ۲: بازده TEPIX

۲-۵- یافته های تخمین حافظه بلندمدت

انتخاب تعداد عرض فرکانس مرتبه پایین (پهنای باند) در تخمین پارامتر حافظه بلندمدت با روش های GPH و GSP از مباحث مهم در این نوع تخمین می باشند؛ بهطوری که مرتبه بالای عرض دوره نگاشت باعث اریب در تخمین d می شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن مرتبه بسیار پایین عرض دوره نگاشت، منجر به افزایش تغییر پذیری نمونه گیری تخمین به علت کاهش اندازه نمونه، خواهد شد. به این منظور برای ارزیابی مستدل و محکم برآوردهای GPH و GSP بر حسب انتخاب پهنای باند، چندین ارزش پهنای باند m انتخاب می گردد؛ بهطوری که تغییر ارزش ها تابعی از اندازه نمونه T خواهند بود و از طریق $m = T^\alpha$ بواسطه $\alpha = \{0.5, 0.55, 0.65\}$ مشخص می شوند. نتایج پیرو جدول ۳ و طبق آماره GPH از وجود حافظه بلندمدت در تمام ارزش های پهنای باند m حمایت می کند و همچنین آماره GSP فاصله معناداری از صفر نداشته و فرض صفر این آزمون (عدم وجود حافظه بلندمدت ($d=0$)) شبیه آماره GPH رد می شود.^{۶۷}

جدول شماره ۳: تخمین پارامتر d با روش های نیمه پارامتریک

$m = T^{\alpha(0.5, 0.55, 0.65)}$	$m=51$	$m=76$	$m=168$
GPH(d parameter)	۰.۲۸۸۲۸۸ (۰.۱۰۱۸۵۱) [۰...۰۴۶]	۰.۲۹۰۶۸۸ (۰.۰۸۰۹۹۶۶) [۰...۰۰۳]	۰.۲۸۴۶۲۷ (۰.۰۵۲۳۳۶) [۰...۰۰۰]
GSP(d parameter)	۰.۲۰۷۷۳۴ (۰.۰۷۰۰۱۴) [۰...۰۳۰]	۰.۲۴۴۳۹۳ (۰.۰۵۷۳۵۳۹) [۰...۰۰۰]	۰.۳۳۷۴۹۸ (۰.۰۳۸۵۷۵۸) [۰...۰۰۰]

توضیحات: اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد پارامتر d می باشند.
مقادیر داخل کروشه p-value فرض صفر ($d=0$) آزمون ها می باشند.

در ادامه با توجه اینکه تخمین روش های GPH و GSP برای یک فرایند ARFIMA(p,d,q) به دلیل نادیده انگاشتن اجزای کوتاه مدت دارای اریب می باشند (همان طور که اگیاکلوگلو و همکاران (۱۹۹۲) این امر را در آزمون GPH اثبات کردند)، به بررسی آزمون پارامتریک حافظه بلندمدت پرداخته می شود. در جهت این امر و برای برآورد پارامتر حافظه با استفاده از روش CLM، تمام مدل های ممکن برای $p=0, 1, 2$ و $q=0, 1, 2$ به استثنای $p=q=0$ را تخمین زده و سپس بر اساس معیار AIC مدل انتخاب می گردد. برای تخمین از نرم افزار Oxmetric/Pcgive استفاده شده است. نتایج ارائه شده در جدول شماره ۴ بیانگر این است که در بازه زمانی مورد بررسی، حافظه

بلندمدت به علت معناداری و اینکه مقدار پارامتر d که بین $0.5 < d < 0$ قرار گرفته است، وجود دارد. در این صورت بین داده ها در بازه زمانی مشخص شده خودهمبستگی معناداری وجود دارد. بنابراین فرض گام تصادفی در بازار اوراق بهادار تهران نفی می شود و بالطبع، چنین بازاری قابل پیش بینی خواهد بود.

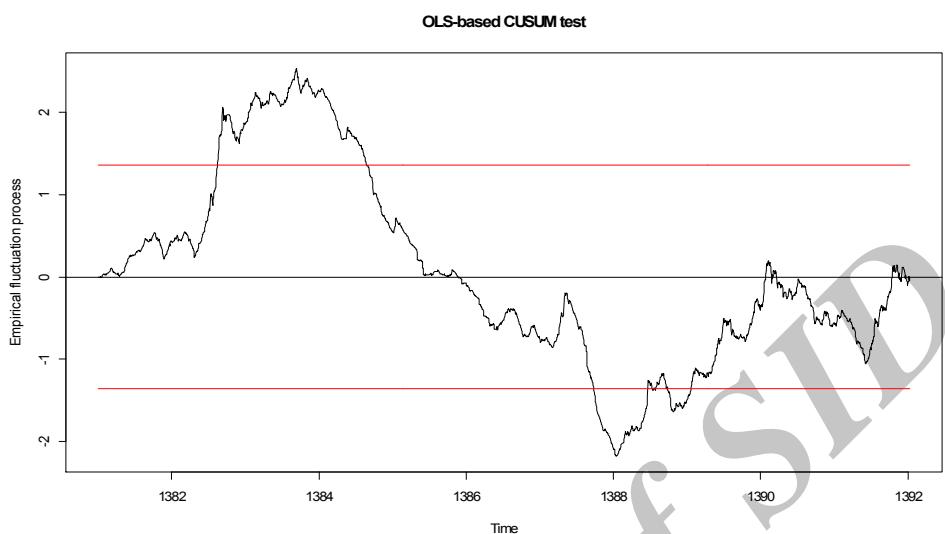
جدول شماره ۴: تخمین پارامتریک مدل ARFIMA بر اساس CLM

پارامترها	Estimates	Std. Errors	t-value	Prob.
d MA(1) μ	۰.۲۲۱۲۱۰	۰.۰۲۱۶۹	۱۰.۲	۰.۰۰۰
	۰.۱۱۹۳۰۰	۰.۰۲۷۶۵	۴.۳۱	۰.۰۰۰
	۰.۱۰۲۹۶۵	۰.۰۶۲۰۹	۱.۶۶	۰.۰۹۷
Log-likelihood AIC Mean(daily returns) var(daily returns)	-۲۲۳۸.۸۰۲ ۱.۶۸۱۸۹ ۰.۰۹۰۰۹ ۰.۵۶۰۲۸		Mean(residuals) Std.Devn(residuals) Skeweness Excess kurtosis	-۰.۰۰۱۰۶۹۵ ۰.۵۶۰۱۸ -۰.۱۵۵۰۳ ۱۳.۱۹۶

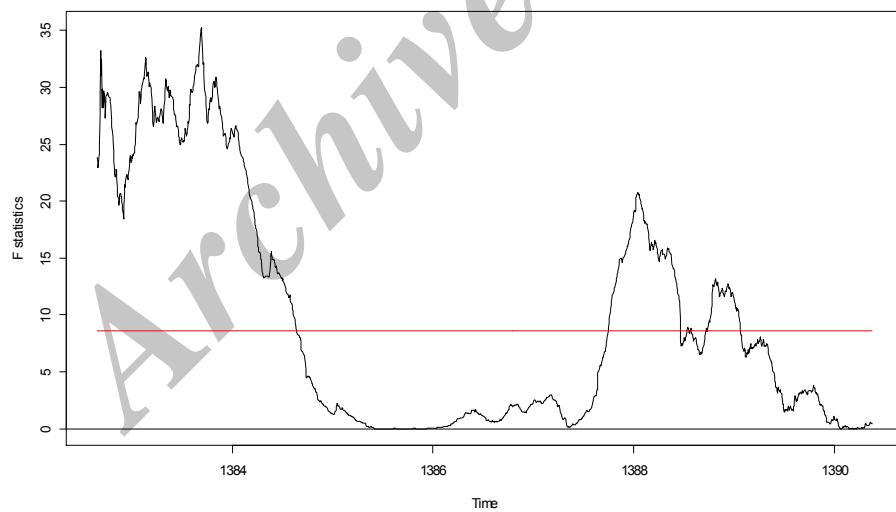
۳-۵- تشخیص و برآورد نقاط زمانی شکست

در این بخش، برای چک کردن تغییرات ساختاری در مدل، ابتدا فرایند OLS مبنی بر CUSUM مطابق معادله $W_n^0(t) = \frac{1}{\hat{\sigma}\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{[nt]} \hat{u}_i, \quad (0 \leq t \leq 1)$ بکار برده می شود. آنچه از شکل ۳ مشهود

است، اوج و فروید فرایند نوسان بر اساس OLS مبنی بر CUSUM در سطح معنی داری ۹۵٪، نشان می دهد که نوسانات از کرانه ها تجاوز کرده است و مسیر CUSUM دو سطح انتقال را در اواخر سال ۱۳۸۳ و اوایل سال ۱۳۸۸ را نمایان می کند. همچنین آزمون آماره SupF که در شکل ۴ ارائه شده است نیز در سطح معنی داری ۹۵٪، فرض صفر عدم شکست ساختاری را رد می کند که تایید دوباره ای بر وجود حداقل یک تغییر ساختاری در سری مورد نظر می باشد.

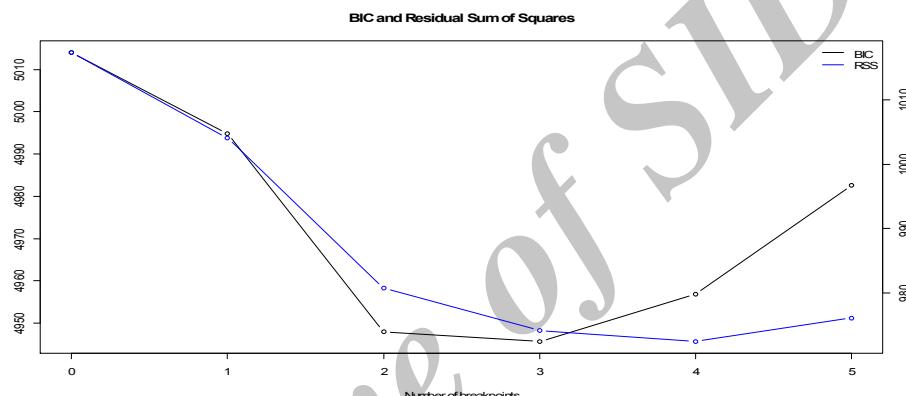


شکل شماره ۳: OLS مبنی بر CUSUM

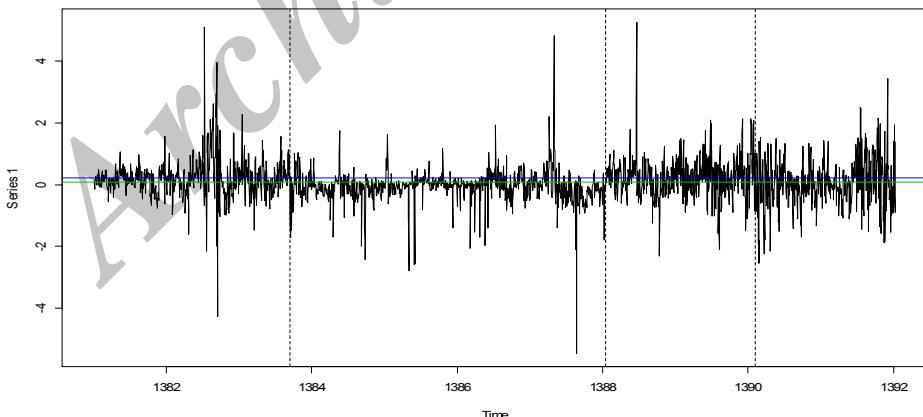


شکل شماره ۴: آماره SupF

برای زمان بندی کردن نقاط شکست در رگرسیون مدل با کاربرد روش بای و پرون گرفته شد که در این جهت مطابق شکل ۵ و همچنین با گزارش مقدار آمارهای دقیق شکل مذکور، که در جدول ۵ ارائه شده است، BIC از سه نقطه شکست در سری بازده TEPIX حمایت می کند. در ادامه شکل ۶ نشان دهنده زمان های تخمین زده شدهی نقاط شکست بای و پرون در سری بازده TEPIX می باشد^{۶۸}:



شکل شماره ۵: تعداد نقاط شکست انتخاب شده توسط BIC



شکل شماره ۶: نقاط زمانی شکست

جدول شماره ۵: نتایج آماره‌های BIC و RSS

m	۰	۱	۲	۳	۴	۵
BIC	۵۰۱۴۰.۱۵۲	۴۹۹۴۷.۷۵۷۵	۴۹۹۴۷.۹۶۱۸	۴۹۹۴۵.۶۹۸۵	۴۹۹۵۶.۹۰۶۵	۴۹۹۸۲.۶۵۳۲
RSS	۱۰۱۷.۳۳۰۵	۱۰۰۴.۵۳۷	۹۸۰.۷۷۰۸	۹۷۴.۱۵۸۹	۹۷۲.۴۹۱۳	۹۷۶.۱۳۳۳

توضیحات: m تعداد تغییرات ساختاری در نظر گرفته شده می‌باشد.

اولین نقطه شکست مطابق است با ششصد و پنجاه و یکمین مشاهده که تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ را شامل می‌شود. دومین نقطه شکست در مشاهده ۱۷۰۲ واقع شده است که مطابق با تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ می‌باشد و سومین شکست ساختاری برابر با مشاهده ۲۰۲۳ بوده که تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ را آشکار می‌کند.

۵-۴- تشخیص حافظه صحیح بازار

سری‌های زمانی که توسط فرایند حافظه بلندمدت حقیقی ایجاد می‌شوند، طبق فرایند تولید داده‌ها (DPG)، داده‌های متعدد شکلی در سرتاسر سری را دارا خواهند بود. بنابراین، اگر به اشتباه با استفاده از روش نقاط شکست به بررسی سری پرداخته شود، ممکن است روش شناخت نقاط شکست تعدادی شکست ساختاری را که اصلاً وجود ندارند، گزارش دهنند. در پی آن، نقاط شکست جعلی تعداد پارتویشن‌های با طول‌هایی متفاوت ایجاد خواهند کرد که هر پارتویشن خرده نمونه‌ای از سری اصلی خواهند بود. از این رو، خرده نمونه‌ها ویژگی‌های آماری یکسانی را همانند سری اصلی به علت اینکه از کمیت واحدی نشات گرفته‌اند، نشان می‌دهند. بنابراین هر نوع نتیجه تفاضل تخمین زده شده، خواه فرایند تصادفی و یا همبستگی سری‌الی حافظه بلندمدت بین محدوده رژیم‌ها باشد، متفاوت نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر سری‌های زمانی یک یا چند شکست ساختاری حقیقی را دارا باشد، سری یک یا چند ناپیوستگی در فرایند تولید داده‌ها خواهد داشت.^{۶۹}

در این بخش، ابتدا خصوصیات آماری درون رژیم‌ها برای درک خصوصیات هر خرده نمونه ذکر شده و سپس آزمون‌های حافظه بلندمدت، بر حسب محدوده‌ی رژیم‌ها برآورده می‌شود. در ابتداء، طبق آماره‌های تشخیصی رژیم‌ها در جدول ۶، تمامی آزمون‌های جارک-برا، باکس-پیرس و ARCH (جز آزمون جارک-برا در آخرین دوره) در سطح صفر رد شده‌اند و همچنین در ازاء بزرگتر بودن انحراف معیار‌ها از میانگین داده‌ها در تمام دوره‌ها و وجود چولگی و کشیدگی بالا در تمام خرده سری‌ها -بجز آخرین دوره- می‌توان با کمی اغماس استنباط کرد که همه‌ی دوره‌ها پیرو الگوی آماری یکسانی می‌باشند. در ادامه با در نظر گرفتن آزمون‌های نیمه پارامتریک حافظه بلندمدت (GSP و GPH) برای قبل و بعد شکست‌ها، نتایج، معناداری پارامترهای تفاضل کسری را

به استثنای چند مورد که در جدول ۷ نمایش داده شده است، اثبات می‌کند. بعلاوه، آزمون پارامتریک CML که در جدول ۸ نتایج آن ارائه شده است، از وجود حافظه بلندمدت در تمام نقاط زمانی قبل و بعد از شکست ها حمایت می‌کند. با این وجود، برای اطمینان از اینکه حافظه بلندمدت مشاهده شده ناشی شده از نقاط شکست موجود در سری می‌باشد یا خیر، آزمون GPH اصلاح شده اسمیت (۲۰۰۵)^۷ انتخاب و آزمون می‌گردد. نتایج (جدول ۹) نشان می‌دهد که مقادیر آزمون GPH تعديل شده در تمام ارزش‌های انتخاب شده که بیشتر از مقدار GPH کلاسیک می‌باشد و طبق یافته‌های اسمیت (۲۰۰۵) می‌توان بیان کرد که سطوح انتقال علت حافظه بلندمدت در پژوهش مذکور نمی‌باشد. بنابراین با توجه به الگوی آماری تقریباً یکسان خرد سری‌های زمانی و اثبات وجود حافظه بلندمدت در قبل و بعد شکست های ساختاری و اینکه شکست ها سبب حافظه بلندمدت نمی‌باشد، می‌توان چنین ادعا کرد که پارتبیشن های هر رژیم فرآکتالی از سری اصلی (بدون اعمال تقسیم بندی زمانی مطابق نقاط شکست) پژوهش حاضر می‌باشند. به عبارت دیگر، با توجه به نتایج بدست آمده از جداول تخمین زده شده در این بخش می‌توان وجود حافظه بلندمدت در بازده TEPIX را به قطعیت و بدون اثرگذاری شکست‌های ساختاری اثبات کرد و می‌توان این استنباط را ارائه نمود که سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار تهران، گرایش به عکس‌العمل آهسته و تدریجی نسبت به ورود اطلاعات جدید دارند؛ که این امر طبق فرایند شرطی در بازار خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که بازار اوراق بهادار تهران نمی‌تواند به عنوان بازار کارا از لحاظ سرعت انتقال اطلاعات بررسی شود. از این رو، امکان کسب سودهای غیرعادی باثبات در چنین بازاری وجود دارد و پیرو این نتیجه، فرض شکل ضعیف کارایی بازار نیز نقض خواهد شد.

جدول شماره ۶: آماره توصیفی بازده TEPIX مطابق با نقاط زمانی قبل و بعد شکست ها

دوره های زمانی	از ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ تا ۱۳۸۳/۰۸/۱۲	از ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ تا ۱۳۸۸/۰۱/۰۹	از ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ تا ۱۳۹۰/۰۱/۲۷	از ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
تعداد مشاهدات	۶۵۱	۱۰۵۱	۵۰۰	۴۶۵
میانگین	۰.۲۱۴۲۶	-۰.۰۵۲۹۷۳	۰.۲۴۱۹۸	۰.۰۷۶۳۲۲
انحراف معیار	۰.۶۱۵۱۷	۰.۴۹۲۷۸	۰.۶۴۴۶۹	۰.۷۵۴۵۸
چولگی	۰.۹۲۲۶۵	-۱.۸۹۴۲	۱.۰۵۰۷	۰.۱۵۴۸۱
کشیدگی اضافی	۱۳.۵۱۶	۱۱.۲۵۹	۸.۱۸۹۶	۱.۳۹۴۱
J-B	**۵۰.۴۷۶	**۳۸۲۷.۶	**۱۴۸۹.۳	۳۹.۵۱۲
Q(20)	*۳۲۸.۲۱۳	*۱۴۱.۵۱۲	۱۸۹.۳۴۴	*۹۱.۷۲۶۹

دوره های زمانی	از ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ تا ۱۳۸۳/۰۸/۱۳	از ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ تا ۱۳۸۸/۰۱/۰۹	از ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ تا ۱۳۹۰/۰۱/۲۷	از ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
$\mathcal{Q}_s(20)$	*۲۹۷.۳۸۱	*۶۹.۸۹۹۲	*۴۹.۶۳۴۰	*۱۱۵.۷۰۶
ARCH(5)	*۱۸.۲۴۵	*۵.۷۷۱۵	*۱۰.۷۲۷	*۹.۵۰۹۳

توضیحات: J-B ارزش آماره جارک- برا باقیمانده های بازده را نشان می دهد. $\mathcal{Q}_s(20)$ آماره آزمون پاکس-پیرس را به ترتیب برای باقیمانده بازده و مریعات باقیمانده بازده تا مرتبه ۲۰ سریال همبستگی، بیان می کنند. ARCH(5) نمایانگر آماره-تی شاخص آزمون ARCH می باشد. ** و * به ترتیب نشان دهنده رد معناداری فرض صفر آزمون ها در سطح معناداری ۹۵٪ و ۹۰٪ می باشند.

جدول شماره ۷: تخمین GPH و GSP مطابق نقاط زمانی قبل و بعد شکست ها

GPH(d parameter)		GSP(d parameter)				
$m = T^{(0.5, 0.55, 0.65)}$	$m = T^{(0.5)}$	$m = T^{(0.55)}$	$m = T^{(0.65)}$	$m = T^{(0.5)}$	$m = T^{(0.55)}$	$m = T^{(0.65)}$
از ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ تا ۱۳۸۳/۰۸/۱۳	۰.۳۹۱۵۸۵ (۰.۱۵۷۰۲) [۰.۰۱۲۶]	۰.۴۲۱۹۲۲ (۰.۱۲۷۵۹۵) [۰.۰۰۰۹]	۰.۳۱۰۹۷۳ (۰.۰۸۷۴۰۰۱) [۰.۰۰۰۴]	۰.۴۸۳۶۹۵ (۰.۱) [۰.۰۰۰۰]	۰.۴۷۰۶۴۳ (۰.۰۸۴۵۱۵۴) [۰.۰۰۰۰]	۰.۲۳۷۸۲۷ (۰.۰۶۱۰۸۴) [۰.۰۰۰۱]
از ۱۳۸۳/۰۸/۱۳ تا ۱۳۸۸/۰۱/۰۹	۰.۲۷۶۸۲۵ (۰.۱۳۴۵۹) [۰.۰۳۹۷]	۰.۲۵۱۹۳۹ (۰.۱۰۹۶۴۳) [۰.۰۲۱۶]	۰.۴۰۷۹۳۳ (۰.۰۷۲۸۰۶۶) [۰.۰۰۰۰]	۰.۳۰۲۴۵۶ (۰.۰۸۸۳۸۸) [۰.۰۰۰۶]	۰.۲۷۳۴۶۵ (۰.۰۷۴۵۳۵۶) [۰.۰۰۰۲]	۰.۴۰۲۲۷۵ (۰.۰۵۲۱۲۸) [۰.۰۰۰۰]
از ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ تا ۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۰.۲۱۰۸۸۴ (۰.۱۷۰۳۸) [۰.۲۱۵۸]	۰.۲۰۶۰۲۵ (۰.۱۴۰۲۷۲) [۰.۱۴۱۹]	۰.۲۶۴۵۹۳ (۰.۰۹۶۹۹۱۴) [۰.۰۰۰۶۴]	۰.۲۵۲۰۹ (۰.۱۰۶) [۰.۰۱۸۰]	۰.۲۴۷۳۴۷ (۰.۰۹۱۲۸۷۱) [۰.۰۰۰۶۷]	۰.۲۲۱۳۰۱ (۰.۰۶۶۸۱۵) [۰.۰۰۰۰۹]
از ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰.۳۶۰۱۳۹ (۰.۱۷۵۵۷) [۰.۰۴۰۲]	۰.۲۲۹۹۶۲ (۰.۱۴۳۲۶۷) [۰.۱۰۸۵]	۰.۲۱۶۵۲۲ (۰.۰۹۹۱۰۵۲) [۰.۰۲۸۹]	۰.۱۹۰۳۴۶ (۰.۱۰۹۱۰۹) [۰.۰۸۱۱]	۰.۱۴۶۷۵۸ (۰.۰۹۲۸۴۷۷) [۰.۱۱۴۰]	۰.۱۳۷۱۴۷ (۰.۰۶۸۰۴۱) [۰.۰۴۳۸]
توضیحات: اعداد داخل پرانتز خطای استاندارد پارامتر d می باشند. مقادیر داخل کروشه p-value فرض صفر (d=0) آزمون ها می باشند.						

جدول شماره ۸: تخمین پارامتریک مدل ARFIMA بر اساس CLM مطابق نقاط زمانی قبل و بعد شکستها

دوره های زمانی	از ۱۳۸۰/۰۹/۰۴ تا ۱۳۸۲/۰۸/۱۳	از ۱۳۸۲/۰۸/۱۳ تا ۱۳۸۸/۰۱/۰۹	از ۱۳۸۸/۰۱/۰۹ تا ۱۳۹۰/۰۱/۲۷	از ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ تا ۱۳۹۱/۱۲/۲۸
d parameter	.۲۶۶۸۰۸ (.۰۰۵۷۰۸)	.۱۹۶۱۴۰ (.۰۰۴۸۶۳)	.۱۲۰۴۴۱ (.۰۰۴۲۸۷)	.۱۰۹۴۰۳ (.۰۰۵۱۱۱)
AR(1)	.۰۰۶۱۳۸۴۶** (.۰۰۷۰۴۶)	-	-	-
MA(1)	-	.۱۲۸۱۱۳ (.۰۰۵۴۴۳)	.۴۲۰۰۷۹ (.۰۰۵۲۲۰)	.۲۳۰۳۸۱ (.۰۰۶۷۰۳)
μ	.۲۰۶۳۸۲*** (.۱۱۰۳)	-.۷۷۹۴۱۳*** (.۰۰۵۷۳۸)	.۲۵۲۹۳۸ (.۰۰۷۱۶۲)	.۷۸۶۲۱۶*** (.۰۰۷۵۴۹)
Log-likelibood	-۵۵۶.۲۰۸۷۳۴	-۳۲۲.۱۶۹۵۳۲	-۴۲۰.۹۸۴۳۳۴	-۴۹۹.۱۹۵۹۰۱
AIC	۱.۷۲۱۰۷۱۳۸	۱.۰۰۲۰۵۶۹۳	۱.۶۹۹۹۳۷۳۴	۲.۱۶۴۲۸۳۴۵

توضیحات: مقادیر داخل پرانتز خطاهای استاندارد می‌باشند.

** نشان دهنده رد معناداری در سطح معنی داری ۹۵٪ است. مدلسازی مدل‌ها در هر دوره زمانی بر اساس $p=0,1,2$ و $q=0,1,2$ صورت گرفته است و از میان آنها مدل‌هایی که از AIC کمتری برخوردار هستند، انتخاب شده اند.

جدول شماره ۹: تخمین مدل GPH و GPH اصلاح شده بر اساس روش انتخاب پهنه‌ای باند Plug-in

	GPH	Modified GPH		
		K=2	k=3	k=4
انتخاب پهنه‌ای باند (m) بر اساس روش-Plug-in	.۳۲۰۸**** (.۰۰۸۷۰۲) [۳.۶۸۷]	.۳۵۴۳*** (.۱۷۰۴) [۲.۰۸]	.۳۷۱۵*** (.۱۴۱) [۲.۶۳۴]	.۳۶۴*** (.۱۲۳۷) [۲.۹۴۲]

توضیحات: جدول شامل تخمین d توسط GPH و GPH اصلاح شده اسمیت (۲۰۰۵) با خطای استاندارد () و t-value [] که به ترتیب در زیر تخمین d قرار گرفته اند، می‌باشد.

*** نشان دهنده معناداری در سطح معنی داری ۹۹٪ است. ** نمایانگر معناداری در سطح معنی داری ۹۵٪ و * ارائه دهنده معناداری در سطح معنی داری ۹۰٪ می‌باشد.

پیرو اسمیت (۲۰۰۵)، زها ($j=1, 2, 3, \dots, m$) بر اساس روش Plug-in هورویچ و دئو (۱۹۹۹) انتخاب شده است، به طوریکه برای GPH این مقدار برابر با ۶۷ و برای GPH تعديل شده به ترتیب مقدار k برابر با ۱۲۵ و ۱۴۰ می‌باشد.

K نمایانگر سنجش مدرج از ۱ الی ۵ است که سه ارزش متفاوت ۲، ۳ و ۴ برای k اختیار شده است.

۶- نتیجه گیری و بحث

حافظه بلندمدت و تغییر ساختاری از موضوعاتی است که به راحتی باعث سردرگمی در بررسی سری‌های زمانی می‌شود؛ به طوری که، بیشتر پژوهشگران مشکل شکست ساختاری را در آزمون حافظه بلندمدت نادیده می‌گیرند. در حقیقت، شواهدی وجود دارد که فرایند حافظه کوتاه مدت ایستا با نقاط شکست در میانگین می‌تواند نرخ آهسته کاهش در تابع خودهمبستگی و دیگر خصوصیات فرایند های انباشته کسری را نشان دهد. بنابراین سری زمانی با داشتن نقاط شکست، ماندگاری قوی را در تابع خودهمبستگی ایجاد می کند که رفتار فرایند حافظه بلندمدت در آن مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، فرایندهای حافظه بلندمدت ممکن است به شناخت جعلی نقاط شکست منجر شود. از این‌رو، هدف اصلی مطالعه حاضر، استنباط صحیح حافظه بازده TEPIX می‌باشد.

برای دستیابی به هدف مذکور، ابتدا پارامتر حافظه بلندمدت را با استفاده از روش‌های نیمه پارامتریک (GPH) و پارامتریک (CLM) بدون توجه به نقاط شکست تخمین زده و در گام بعدی، با استفاده از روش OLS مبنی بر مجموع انباشته (CUSUM)، آزمون SupF و روش بای و پرون (۱۹۹۸، ۲۰۰۳) به تعیین و تشخیص نقاط زمانی شکست اختصاص داده شده است. نتایج مشاهده شده حاکی از وجود همزمان حافظه بلندمدت و نقاط زمانی شکست در سری می‌باشد. بنابراین برای استنباط صحیح در مورد حافظه بلندمدت با توجه به وجود نقاط شکست، به بررسی ویژگی‌های آماری و حافظه بلندمدت در دوره‌های قبل و بعد نقاط زمانی شکست پرداخته شد که نتایج، از الگوی آماری تقریبی یکسان و از وجود حافظه بلندمدت در تمام دوره‌های زمانی تقسیم بندی شده بواسطه شکست‌های ساختاری حمایت می‌کند. بعلاوه، برای اطمینان از اینکه حافظه بلندمدت مشاهده شده ناشی شده از نقاط شکست موجود در سری می‌باشد یا خیر، آزمون GPH اصلاح شده اسمیت (۲۰۰۵) را انتخاب و آزمون شده است. نتایج نشان داد که مقادیر آزمون GPH اصلاح شده در تمام ارزش‌های انتخاب شده k بیشتر از مقدار GPH کلاسیک می‌باشد و طبق یافته‌های اسمیت (۲۰۰۵) می‌توان بیان کرد که سطح انتقال‌ها علت حافظه بلندمدت نخواهد بود. بنابراین می‌توان چنین ادعا کرد که پارتبیشن‌های هر رژیم فرآکتالی از سری زمانی مورد تحقیق می‌باشند و به عبارت دیگر، همه‌ی خرده سری‌ها ویژگی‌های یکسانی همانند سری اصلی را در بردارند. در نهایت، پژوهش حاضر به این استنباط ختم می‌شود که حافظه بازده TEPIX، بلندمدت و حقیقی بوده و بالطبع، نمی‌تواند تحت تاثیر شکست‌های ساختاری قرار گیرد.

فهرست منابع

- * تیموری، محمد و طالبلو، رضا. (۱۳۸۹). پویایی‌های تورم و رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، شماره اول، صص ۱۷۰-۱۳۷.
- * عرفانی، علیرضا. (۱۳۸۷). بررسی حافظه‌ی بلندمدت بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، سال هشتم، شماره بیست و هشتم، صص ۷۷-۹۲.
- * عرفانی، علیرضا. (۱۳۸۸). پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال ۴۴، شماره ۸۶، صص ۱۶۳-۱۸۰.
- * کشاورز حداد، غلامرضا و صمدی، باقر. (۱۳۸۸). برآورد و پیش‌بینی تلاطم بازده در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‌ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‌های خانواده FIGARCH، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال ۴۴، شماره ۸۶، صص ۱۹۳-۲۳۵.
- * محمودی، وحید، محمدی، شاپور و هستی، چیت سازان. (۱۳۸۹). بررسی روند حافظه بلندمدت در بازار‌های جهانی نفت، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال ۱، شماره ۱، صص ۲۹-۴۸.
- * مرزبان، حسین و نجاتی، مهدی. (۱۳۸۸). شکست ساختاری در ماندگاری تورم و منحنی فیلیپس در ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال ۳، شماره ۲ (پیاپی ۸)، صص ۱-۲۶.
- * Agiakloglou, C., Newbold P., Wohar, M. (1993). Bias in an estimator of the fractional difference parameter, *Journal of Time Series Analysis*, 14: 235-246.
- * Andrews, D.W.K, Lee, I. and Ploberger, W. (1996). Optimal Change Point Tests Normal Linear Regression, *Econometrica*, 64: 9-38.
- * Andrews, D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Points, *Econometrica*, 61: 821-856.
- * Bai J., Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models, *Journal of Applied Econometrics*, 18: 1-22.
- * Bai, J. and Perron, P. (1998). Testing for and Estimation of Multiple Structural Changes, *Econometrica*, 66: 47-79.
- * Baillie, R.T., Bollerslev T. and Mikkelsen H.O. (1996). Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, *Journal of Econometrics*, 74(1): 3-30
- * Balcilar, M. (2002). Persistence in Inflation: Long Memory, Aggregation, or Level Shifts?, sixth METU International Conference on Economics, September 11-14, 2002, Ankara, Turkey
- * Beran, J. (1995). Maximum likelihood estimation of the differencing parameter for invertible short and long memory autoregressive integrated moving average models, *Journal of the Royal Statistical Society*, 57(4): 659–672.

- * Beveridge, S. and Oickle, C. (1993). Estimating fractionally integrated time series models, *Economics Letters*, 43(2): 137–142.
- * Breidt, F.J. and Hsu, N.J. (2002). A Class of Nearly Long-Memory Timer Series Models, *International Journal of Forecasting*, 18: 265-281.
- * Brown, R. L., Durbin, J. and Evans, J. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time, *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 37(2):149–192.
- * Cheung, Y.W. and Diebold, F.X. (1994). On maximum likelihood estimation of the difference parameter of fractionally integrated noise with unknown mean, *Journal of Econometrics*, 62(2): 301-316.
- * Choi, K., and Zivot, E. (2007). Long Memory and Structural Changes in the Forward Discount: An Empirical Investigation, *Journal of International Money and Finance*, 26: 342-363.
- * Chow, G.C. (1960). Tests for Inequality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions, *Econometrica*, 28: 591-605.
- * Chung, C. F. and Baillie, R.T. (1993). Small sample bias in conditional sum of squares estimators of fractionally integrated ARMA models, *Empirical Economics*, 18(4): 791–806
- * De Pooter, M., Martens, M. and van Dijk, D. (2008). Predicting the daily covariance matrix of S&P100 stocks using intraday data-but which frequency to use?, *Econometric Reviews*, 27 (1-3)
- * Diebold, F.X. and Inoue, A. (2001). Long Memory and Regime Switching, *Journal of Econometrics*, 101: 131-159.
- * Dittman, I. and Granger, C.W.J. (2002). Properties of nonlinear transformations of fractionally integrated processes, *Journal of Econometrics*, 110(2): 113-133.
- * Doornik J.A. and Ooms, M. (2003). Computational aspects of maximum likelihood estimation of autoregressive fractionally integrated moving average models, *Computational Statistics & Data Analysis*, 42(3): 333-348.
- * Doornik, J.A. and Ooms, M. (2004). Inference and forecasting for ARFIMA models, with an application to US and UK inflation, *Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics*, 8(2): Article 14.
- * Engle, R.F. and Smith, A.D. (1999). Stochastic permanent breaks. *Review of Economics and Statistics*, 81(4): 553-574.
- * Geweke, J. and Porter-Hudak, S. (1983). The Test and Application of Long memory Time Series Models, *Journal of Time Series Analysis*, 4(4): 221-238.
- * Granger, C. W. J. and Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long Memory Time Series Models and Fractional Differencing, *Journal of Time Series Analysis*, 1(1): 15-29.
- * Granger, C.W.J. and Ding. (1996). Varieties of Long Memory Models, *Journal of Econometrics*, 73: 61-77.
- * Granger, C.W.J. and Hyung, N. (2004). Occasional structural breaks and long memory with an application to the S&P 500 absolute stock returns, *Journal of Empirical Finance*, 11: 213-228.

- * Granger, C.W.J. and Hyung, N. (1999). Occasional Structural Breaks and Long Memory, Discussion Paper 99-14, Department of Economics, University of California, San Diego.
- * Hidalgo, J. and Robinson, P.M. (1996). Testing for Structural Change in a Long Memory Environment, *Journal of Econometrics*, 70: 159-174.
- * Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing, *Biometrika*: 68(1): 165-176
- * Hurvich, C.M., Deo, R., and Brodsky, J. (1998). The Mean Squared Error of Geweke and Porter-Hudak's Estimator of the Memory Parameter of a Long-Memory Time Series, *Journal of Time Series Analysis*, 19: 19-46.
- * Hurvich, C.M. and Deo, R. (1999). Plug-in Selection of the Number of Frequencies in Regression Estimates of the Memory Parameter of a Long Memory Time Series, *J. Time Series Analysis*, 20(3): 331-341.
- * Künsch, H.R. (1986). Discriminating between monotonic trends and long-range dependence, *Journal of Applied Probability*, 23: 1025-1030.
- * Liu, M. (2000). Modeling Long Memory in Stock Market Volatility, *Journal of Econometrics*, 99: 139-171.
- * Lo, A.W. (1991). Long-Term Memory in Stock Market Volatility, *Journal of Econometrica*, 59(5): 1279-1313.
- * Lobato, I.N. and Savin, N.E. (1998). Real and Spurious Long Memory Properties of Stock Market Data, *Journal of Business and Economic Statistics*, 16: 261-268.
- * Mandelbrot, B. B. and Wallis, J. R. (1969). Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises. Parts 1, 2, 3, *Water Resources Research*, 5(1): 967-988.
- * Ohanessian, A., Russell, J.R. and Tsay, R.S. (2004). True or spurious long memory in volatility: does it matter for pricing options?, Unpublished Manuscript. Graduate School of Business, University of Chicago.
- * Ploberger, W. and Kramer, W. (1992). The CUSUM test with OLS residuals, *Econometrica*, 60: 271-285
- * Robinson, P. M. (1995). Log-periodogram regression of time series with long range dependence, *The Annals of Statistics*, 23(3): 1048-1072.
- * Robinson, P.M. and Henry, M. (1998). Long and Short Memory Conditional Heteroscedasticity in Estimating the Memory Parameter of Levels, Discussion paper STIDERC Econometrics EM/98/357, London School of Economics and Political Science.
- * Robinson, P.M. (1991). Testing for strong serial correlation and dynamic conditional heteroscedasticity in multiple regressions, *Journal of Econometrics*, 47: 67-84.
- * Sakoulis, G., Zivot, E. (2001). Time variation and structural change in the forward discount: Implications for the forward rate unbiasedness hypothesis, Working Paper, Department of Economics, University of Washington.
- * Sibbertsen, P. (2004). Long memory versus structural breaks: an overview, *Statistical Papers*, 45: 465-515
- * Smith, A. (2005). Level Shifts and the Illusion of Long Memory in Economic Time Series, *Journal of Business and Economic Statistics*, 23 (3): 321-335
- * Sowell, F. (1987). Maximum likelihood estimation of fractionally integrated time series models. Discussion Paper Department of Economics. Duke University.

- * Sowell, F. (1992). Maximum Likelihood Test of Stationary Univariate Fractionally Integrated Time Series Models, *Journal of Econometrics*, 53(1): 165-188.
- * Taylor, S.J. (2000). Consequences for option pricing of a long memory in volatility, Unpublished Manuscript, Department of Accounting and Finance, Lancaster University.
- * Yusof, F., Kane, I. L. and Yusop, Z. (2013). Structural break or long memory: an empirical survey on daily rainfall data sets across Malaysia, *Hydrology and Earth System Sciences*, 17: 1311–1318

یادداشت‌ها

- ¹ Cumulative Sums
- ² Bai and Perron
- ³ Hyperbolically
- ⁴ Autocorrelation
- ⁵ Mandelbrot & Wallis
- ⁶ Granger & Joyeux
- ⁷ Hosking
- ⁸ Geweke & Porter-Hodak
- ⁹ Lo
- ¹⁰ Sowell
- ¹¹ Cheung & Diebold
- ¹² Robinson
- ¹³ Engle & Smith
- ¹⁴ Dittman & Garanger
- ¹⁵ Doornik & Ooms
- ¹⁶ likelihood based
- ¹⁷ Liu
- ¹⁸ Granger and Ding
- ¹⁹ Granger and Hyung
- ²⁰ Breidt and Hsu
- ²¹ Hidalgo and Robinson
- ²² Lobato and Savin
- ²³ Taylor
- ²⁴ Ohanessian et al
- ²⁵ Options
- ²⁶ Diebold and Inoue
- ²⁷ Sakoulis and Zivot
- ²⁸ Smith
- ²⁹ Geweke & Porter-Hodak
- ³⁰ Alternative
- ³¹ Choi and Zivot.
- ³² de Pooter et al
- ³³ Autoregressive
- ³⁴ Moving average
- ³⁵ Antipersistent
- ³⁶ Intermediate memory

³⁷ Gaussian semi-parametric³⁸ Conditional Maximum Likelihood³⁹ Periodogram⁴⁰ Agiakloglou et al⁴¹ برای جزئیات بیشتر در مورد تخمین زن GPH تعدادی شده اسمیت (۲۰۰۵) به مقاله ذیل مراجعه کنید.

Level Shifts and the Illusion of Long Memory in Economic Time Series

⁴² Künsch⁴³ Robinson⁴⁴ Robinson & Henry⁴⁵ heteroscedasticity⁴⁶ Hurvich et al⁴⁷ Exact Maximum Likelihood⁴⁸ Sowell⁴⁹ Beran⁵⁰ Beveridge & Oickle⁵¹ Chung & Baillie⁵² Monte Carlo⁵³ Ploberger and Kramer⁵⁴ Empirical fluctuation processes⁵⁵ Andrews⁵⁶ Trimming value

تخمین زن تراوید (Trimmed Estimator): تخمین زنی است که از تخمین زن دیگر با حذف بعضی مقادیر کرانی آن بدست می‌آید. عموماً این امر برای بدست امدن آماره‌ی محکم و مستدل تر انجام می‌پذیرد. ارزش n درصد تراوید توسط نادیده گرفتن n درصد بالاترین و پایین ترین مشاهدات بدست می‌آید؛ برای مثال ۵ درصد ارزش تراوید، مشاهدات بالاتر از ۵ درصد تا ۹۷.۵ درصد را شامل می‌شود.

⁵⁷ Covariate⁵⁸ Residual Sum of Squares⁵⁹ Jarque-Bera⁶⁰ Box-Pierce⁶¹ Lagrange multiplier⁶² Mackinnon⁶³ Augmented Dickey-Fuller⁶⁴ Phillips &Perron⁶⁵ Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin⁶⁶ Baillie & et al

⁶⁷. نتایج تخمین GPH و GSP توسط Oxmetric سورت گرفته است.

⁶⁸ تمام آزمون های مربوط به نقاط شکست توسط نرم افزار R و با استفاده از پکیج strucchange سورت گرفته است. ⁶⁹ لازم به ذکر است که مقدمه ذکر شده در این بخش، دلیلی بر وجود یا عدم وجود نقاط شکست واقعی در این پژوهش نمی باشد. بررسی تحلیلی وجود شکست ساختاری علاوه بر تشخیص کمی، لازمه‌ی تشخیص واقعی نقاط شکست می‌باشد؛ اما به دلیل گستردگی تحقیق در این زمینه، نیاز به پژوهش خاص لازم می‌باشد. در پژوهش حاضر، فقط به تحلیل کمی نقاط شکست پسنده شده است و صرفاً آنچه در فرایند تولید داده‌ها که توسط فرایندهای حافظه بلندمدت یا شکست های ساختاری در شیوه سازی رخ می‌دهد، دلیل استنباط قرار داده شده است.

⁷⁰. این برنامه توسط اسمیت (۲۰۰۵) در محیط برنامه Gauss نوشته شده است. برای دسترسی به این کد به آدرس زیر مراجعه کنید

⁷¹. Hurvich and Deo